微电子器件实验 双极型晶体管的直流特性测量与分析

范云潜, 学号: 18373486, 搭档: 徐靖涵, 教师: 彭守仲

微电子学院 184111 班

日期: 2020年10月21日

1 实验目的

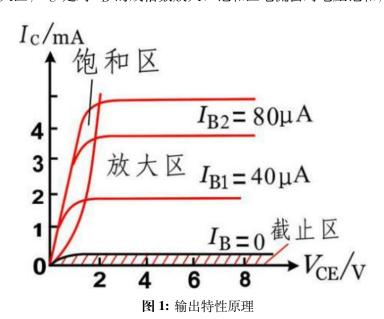
测量不同基极电压情况下,输出电流随着发射极电压的变化情况,并绘制对应的直流特性曲线。

2 实验所用设备及器件

实验用到的核心器件是双极型晶体管 9018, 其他设备包括面包板、杜邦线、电压源、手持万用表、台式万用表、电阻等。

3 实验基本原理及步骤

在不同基极电流情况下,随着集电极电压的变化,电流变化可以依次分为截止区、饱和区与放大区。在放大区, I_C 是对 I_B 的成倍数放大;饱和区电流会对电压饱和,如**图 1** 。



实验步骤:

1. 搭建电路如图 2

- 2. 调节 V_B 使得 $I_B = 20 \mu A$
- 3. 调节 E_C 分别在 0.1-1V 以 0.1V 为间隔,在 1-10V 以 1V 为间隔,测量 V_{CE} 与 I_C
- 4. 调节 V_B 使得 $I_B = 40/60/80/100 \mu A$,重复上述步骤
- 5. 关闭电源,拆解电路,恢复仪器。

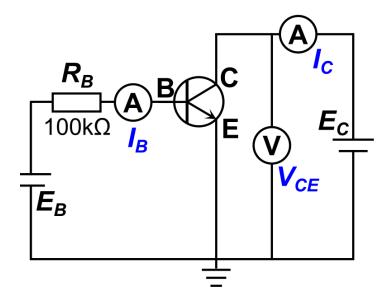


图 2: 实验电路图

4 实验数据记录

原始数据可视化后如图 3 , 原始数据请见 这里。

5 实验结果分析

在不同的电压 V_{CE} 下电流随之上升,分别经过饱和区与放大区。在不同的基极电流 I_B 下,放大区电流可以看出较为线性的放大效果,如 **图 4**。

6 总结与思考

Q1: 截止区、放大区、饱和区的特点?

截止区时发射结几乎未导通,集电极无电流;放大区时发射结正偏,集电结反偏, I_C 几乎与 V_{CE} 无关,是对 I_B 的放大;饱和区发射结与集电结均正偏, V_{CE} 较小, I_C 随 V_{CE} 变化较大, I_B 的变化几乎不会引起 I_C 变化。

Q2: 当 V_{CE} 增大时, I_B 如何变化, 机理是什么?

首先经过饱和区, I_B 急剧上升;再是放大区,变化较为平缓,但是由于基区调制效应,并不是严格的曲线。

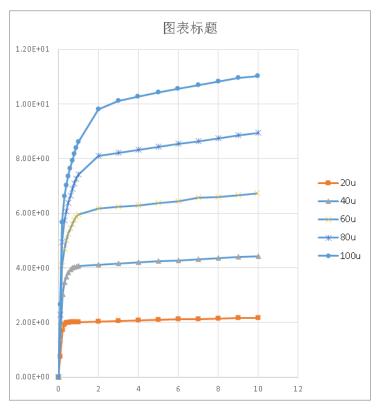


图 3: 实验结果 $I_C - V_{CE}$ 图

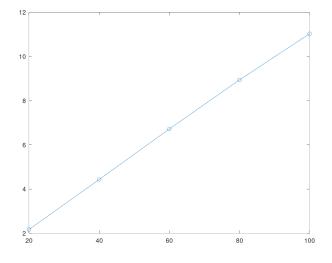


图 4: 实验结果 $I_C - I_B$ 图